

# 2025年度第1回放射線部門ミニシンポジウム開催案内

(一社) 日本非破壊検査協会  
放射線部門  
主査 富澤雅美

日本非破壊検査協会放射線部門では、2025年10月2日、3日に下記の要領で放射線部門ミニシンポジウムを開催いたします。本ミニシンポジウムは、X線による非破壊検査においてそれぞれの用途に、より適する透過像・CT像を得るために必要な関連する原理と特性、及び、関連規格とその役立つ利用法などについての技術を解説し、参加された皆様とそうした技術を共有することを目的に開催します。JISに基づく透過撮影とその読影についての実習、及び、X線検査装置などの見学も予定しています。また、特別講演としまして、「(仮題) 高エネルギー直線加速器と FPD による橋梁の非破壊検査」を予定しています。

対面形式のみの開催です。より多くの皆様にご参加いただけますようにミニシンポジウムとして開催させていただきます。是非ご参加いただけますようご案内申し上げます。

なお、本ミニシンポジウムは、JIS Z 2305 非破壊試験技術者のレベル3再認証試験に適用できるクレジットシステムに該当しております。また、英文の参加証明書を発行できますので、英文参加証明書をご希望の方は事務局までご連絡ください(発行にお時間をいただくことがありますがおご了承ください)。

日時：2025年10月2日(木) 13:00～17:00 講演会  
17:30～19:30 懇親会  
10月3日(金) 9:00～12:20 講演会  
13:30～16:15 実習・見学(定員20名、申込先着順)

会場：(地独) 東京都立産業技術研究センター 本部  
(〒135-0064 江東区青海2-4-10、最寄駅 ゆりかもめテレコムセンター駅、りんかい線東京テレポート駅)

共催：(地独) 東京都立産業技術研究センター

## 参加費：

放射線部門登録団体会員	無料(予稿集を含む)
放射線部門登録個人会員	
登壇者・座長	
上記以外の JSNDI 正会員	¥2,000(予稿集を含む)
非会員	¥3,000(予稿集を含む)
懇親会	¥5,000

講演予稿集は、印刷物にて配布いたします。

懇親会会場：唐苑(東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンター西棟2F)

参加申込締切日：2025年9月19日(金)

申込方法：協会ホームページ(<https://sciences.jsndi.jp/maintenance/studygroup/symposium/>)からお申込みください。

問合せ先：(一社) 日本非破壊検査協会 学術課 八十嶋  
TEL: 03-5609-4015 FAX: 03-5609-4016 E-mail:  
yasoshima@jsndi.or.jp

## プログラム(案)

10月2日(木)

開会挨拶 放射線部門主査 富澤雅美(東芝ユニファイドテクノロジーズ(株)) 13:00～13:05  
東京都立産業技術研究センターの紹介 (地独) 東京都立産業技術研究センター 13:05～13:20

特別講演 座長：富澤雅美(東芝ユニファイドテクノロジーズ(株))

①(仮題) 高エネルギー直線加速器と FPD による橋梁の非破壊検査 13:20～14:00  
長谷川秀一(東京大学)

講演 座長：河原 大吾(東京都立産業技術研究センター)

② X線の発生・透過・検出の各過程で生じる現象、及び、透過像・CT像の画質への影響 14:00～15:05  
富澤雅美(東芝ユニファイドテクノロジーズ(株))

休憩(15:05～15:15)

③ X線発生装置とX線画像検出器のしくみ・種類・特徴, 選定のポイント, 適用例 黒田 豊 (浜松ホトニクス (株))	15:15 ~ 16:55
本日のまとめ, 明日の予定 河原大吾 ((地独) 東京都立産業技術研究センター)	16:55 ~ 17:00
<b>懇親会</b> 唐苑 (東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンター西棟 2F)	17:30 ~ 19:30
<b>10月3日 (金)</b>	
本日の予定 富田康弘 (浜松ホトニクス (株))	9:00 ~ 9:05
<b>講演</b> 座長: 富田康弘 (浜松ホトニクス (株))	
④ X線による試験・検査に関する最近制定・改正された規格とその概要 大岡紀一 ((一社) 日本非破壊検査協会) 釜田敏光 (ポニー工業 (株)) 河原大吾 ((地独) 東京都立産業技術研究センター)	9:05 ~ 10:25
休憩 (10:25 ~ 10:35)	
⑤「JIS Z 3110:2017 デジタル検出器によるX線及びγ線撮影技術」の理解と実用 大岡紀一 ((一社) 日本非破壊検査協会) 河原大吾 ((地独) 東京都立産業技術研究センター) 釜田敏光 (ポニー工業 (株))	10:35 ~ 12:05
セッションのまとめ 本日のまとめ 大岡紀一 ((一社) 日本非破壊検査協会) 富田康弘 (浜松ホトニクス (株))	12:05 ~ 12:10 12:10 ~ 12:15
<b>閉会挨拶</b> (講演の部) 放射線部門主査 富澤雅美 (東芝ユニファイドテクノロジーズ (株))	12:15 ~ 12:20
実習・見学の説明 河原大吾 ((地独) 東京都立産業技術研究センター)	12:20 ~ 12:25
休憩 (12:25 ~ 13:30)	
<b>実習・見学</b> 2組に分かれて実習と見学 ・実習 (JISに基づいて) ・X線フィルムでの読影 (濃度測定, 観察条件の影響など) ・デジタル検出器 DDA と CR による: ・DDA での撮影・読影 (条件を変えて試験体を撮影, $GV \cdot SR_b \cdot SNR_N$ を測定) ・CR での読影 (鮮鋭度の異なる IP による $SR_b$ の違いを測定) ・見学 ・X線関連装置 (X線 CT 装置, Ge 半導体検出器などの各種測定装置)	13:30 ~ 16:15

プログラムは, 種々の理由により予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

講演中のカメラやスマートフォン等による撮影は原則禁止としております。撮影される場合は, 事前に登壇者の了承を得た上で, 登壇前に座長へ申し出るようお願いいたします。